

適用規格					
定 格	使用温度範囲	-55℃～85℃（注1）	保存温度範囲	-10℃～60℃（注2）	
	電 圧	AC 100 V	使用湿度範囲	40 % ～ 80 %	
	電 流	0.4 A	保存湿度範囲	40 % ～ 70 %（注2）	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構 造	外観、構造及び 仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電 氣 的 性 能	接触抵抗	100 mA（DC 又は 1000 Hz）以下で測定する。	45 mΩ以下	○	—
	低電圧、低電流下の 接触抵抗	20 mV 以下、1 mA（DC または 1000 Hz） で測定する	55 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 250Vで測定する。	100 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 300Vの電圧を1分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機 械 的 性 能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	① 接触抵抗： 55 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、振幅 1.5 mm、 3 軸方向各 2 時間試験する。	① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 55 mΩ以下	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3 軸方向各 3 回試験する。	③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
環 境 的 性 能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。	① 接触抵抗： 55 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 100 MΩ以上	○	—
	温度サイクル	温度 -55→+15～+35→+85→+15～+35℃ 時間 30→2～3→30→2～3分 を 5 サイクル試験する。	③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。	○	—
	塩水噴霧	濃度 5 %の塩水、48 時間放置する。	① 接触抵抗： 55 mΩ以下	○	—
	硫化水素	濃度 3 ppm、96 時間放置する。 （試験規格：J E I D A 38）	② はなはだしい腐食がないこと。	○	—
	はんだ耐熱性	【 リフロー 】 ピーク温度 MAX250℃ 220℃以上 60秒以内	外観の変形及び端子などに著しいガタの 無いこと。	○	—
		【 はんだごて 】 こて温度 360℃ はんだ付け時間 5 秒以内		○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 240±3℃、浸せき時間 3秒の はんだ付けを行う。	はんだ浸漬面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。	○	—
△の数		訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考			承認	HS.OKAWA	05.09.06
注1. 通電時の温度上昇を含みます。			検 図	HS.OZAWA	05.09.06
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。			担 当	TH.NODA	05.09.04
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。			製 図	TH.NODA	05.09.04
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-150566-23		
HRS	製品規格表		製品名	FX8-100P-SV (93)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL578-0005-7-93	△ 1/1